XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

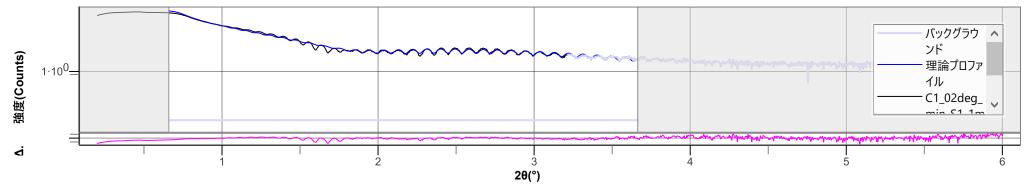
最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)			密度(g/cm³) <d></d>			粗さ(nm) <rgh></rgh>	
✓	L5	Fe2O3		0.029	Const		4.95000	Const	0.643	Con
			±0.016		精密化			大精密化		精密化
\checkmark	L4	Fe2O3	0.00	2.193	Const		3.43364	Const	0.157	Con
			±0.03	0.115	精密化	±0.02		精密化		精密化
\checkmark	L3	Fe	±0.3	0.416	Const 精密化	+0.11	5.55912	Const 精密化	0.409	Con 精密化
		Fe		91.238		±0.11	7.18999	Const	0.106	
\checkmark	L2		±0.04		Const 大 精密化	+0.03			±0.03最 小 ←	Con 精密化
	L1	Fe Fe		2.964	Const		4.35289	Const	0.856	Con
\checkmark			±0.08	2.304	精密化		4.55205	精密化		精密化
<u> </u>	基板	⊡ Si		00			2.32924	Const	0.500	Con